Search Notes

Application/Control No.	Applicant(s)/Patent under- Reexamination	•
10/553,896	ALBERSHEIM ET AL.	
Examiner	Art Unit	
Taeyoon Kim	1651	

	SEARCHED					
Class	Subclass	Date	Examiner			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					
	· · ·		-			

INT	INTERFERENCE SEARCHED						
Class	Subclass	Date	Examiner				
							
		<u> </u>					
	L						

EXMR
TK
тк
тк